

1. 개정이유 및 주요내용

기업의 연구개발 촉진 및 투자 활성화를 위해 「관세법」에 따라 관세를 감면할 수 있는 대상인 산업기술 연구·개발용 물품 중 밀폐 전동기식 펌프, 온도습도시험기, 저산소클린오븐 등을 제외하고, 듀얼 집속 이온 빔 공작기, 압출기, 성형기 등을 추가하여 총 46개 품목에 대해 관세를 감면하려는 것임.

2. 참고사항

- 가. 관계법령 : 생략
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 과학기술정보통신부 등
- 라. 기 타 : 입법예고(2022. 7. 11. ~ 7. 21.)

기획재정부령 제 호

관세법 시행규칙 일부개정령안

관세법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 1의2를 별지와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(관세가 감면되는 산업기술 연구·개발용 물품에 관한 경과조치)
이 규칙 시행 전에 수입신고한 물품에 대해서는 별표 1의2의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

■ 관세법 시행규칙 [별표 1의2]

법 제90조제1항제4호에 따라 관세가 감면되는 산업기술 연구·개발용 물품
(제37조제4항제1호 관련)

연번	관세율포호		품명	규격
	호	소호		
1	8419	60 89	냉각기	영하 35도(℃) 이하로 냉각·냉동 또는 액화할 수 있는 것
2	8419	89	열충격시험기(Temperature Shock Test Chamber)	평판디스플레이, 인쇄회로기판, 반도체소자 또는 반도체 모듈의 성능을 시험하는 것으로서, 설정할 수 있는 최고 온도가 영상 100도(℃) 이상이고 최저온도가 영하 40도(℃) 이하인 것
3	8419	89	항온항습기 (항온기, 항습기 및 항습배양기를 포함한다)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 온도의 허용 오차 범위가 ±3.0도(℃) 이하 이거나 습도의 허용 오차 범위가 ±5퍼센트(%) 이하인 것 2. 사용 온도가 영상 100도(℃) 이상이거나 영하 40도(℃) 이하인 것 3. 70분 내에 영하 40도(℃)에서 영상 150도(℃)까지 온도를 상승시킬 수 있는 것 4. 온도, 습도, 시간, 조명도(照明度) 또는 사이클(Cycle)을 조절할 수 있는 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 가. 온도의 허용 오차 범위가 ±3.0도(℃) 이하인 것 나. 습도의 허용 오차 범위가 ±5퍼센트(%) 이하인 것 다. 열 스트레스(stress)를 가함으로써 시료의 열내구성을 측정할 수 있는 것 라. 계측기와 연결하여 주파수를 측정할 수 있는 것
4	8421 8479	39 89	포집기	유량과 회석비율의 통합 값을 기반으로 입자상 물질(particulate matter)의 질량을 계산하고 저장할 수 있는 것
5	8422	40	진공라미네이터 (Vacuum Laminator)	가압 상태에서는 1.0메가파스칼(Mpa) 이하, 진공 상태에서는 4.0헥토파스칼(Hpa)/15초 이하로 상부와 하부에서 균등하게 압력을 가할 수 있는 것
6	8443	19	스크린 인쇄기	가로와 세로의 길이가 450밀리미터(mm) 이상인 스크린을 사용할 수 있고, 비전 조정카메라(vision align camera)를 이용하여 정밀하게 패턴을 인쇄할 수 있는 것
7	8456	11	레이저발진기	레이저의 파장이 1,340나노미터(nm)이하인 것
8	8456	90	이온밀링기, 이온밀링장치(Ion Milling System, Ion Beam System)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 이온빔(ion beam) 또는 전자빔(electron beam)을 이용하여 반도체웨이퍼 또는 시편(試片)을 가공할 수 있는 것 2. 가속전압이 40킬로볼트(kV) 이하인 아르곤(Ar) 또는 갈륨(Ga) 이온 총(ion gun)을 장착한 것
9	8457	10	머시닝센터 (Machining Center)	머시닝(machining), 선삭(旋削) 및 연삭(研削) 기능을 모두 융합한 복합가공기능이 있는 것

10	8460	24	연삭기(Grinding Machine), 샤프닝 머신(Sharpening Machine)	수치제어방식으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.
	8460	29		1. 기어 프로파일(gear profile) 연삭이 가능한 것
	8460	31		2. 기어 호브 커터(gear hob cutter) 또는 브로치 커터(broach cutter)의 프로파일(profile)이나 날 연삭이 가능한 것
	8460	39		3. 드릴(drill), 엔드밀(end mill) 또는 인서트(insert)의 홈, 여유면, 날끝 각(point) 또는 스플릿 포인트(split point)를 가공하는 전용 연삭기로서, 가공 지름이 0.05밀리미터(mm) 이상 80밀리미터(mm) 이하인 것
	8461	40		4. 스카이빙(skiving)공구를 장착하여 내치기어(internal gear) 또는 외치기어(external gear)를 가공할 수 있는 것
11	8460	40	연마기	5. 제품의 외경과 단면을 동시에 연삭할 수 있는 것
	8460	90		수분을 포함한 습식 연마재를 사용하여 곡면과 요철 부위를 연마할 수 있는 것으로서 원심력에 의한 사출방식 일 것
12	8485	10	3차원프린터 (3D Printer)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.
	8485	20		1. 0.05밀리미터(mm) 이상의 정밀 적층(積層)이 가능한 것 2. 폭이 20마이크로미터(μm) 이하인 선으로 원하는 회로나 모양을 나타낼(patterning) 수 있는 것
13	8543	70	인터페이스 모듈	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.
				1. 캔(CAN, Controller Area Network), 캔에프디(CANFD, Controller Area Network with Flexible Datarate) 또는 플렉스 레이(Flex Ray) 신호를 유에스비(USB, Universal Serial Bus) 방식을 통해 컴퓨터에 연결할 수 있는 것 2. 캔(CAN, Controller Area Network), 캔에프디(CANFD, Controller Area Network with Flexible Datarate), 린(LIN, Local Interconnect Network) 또는 플렉스 레이(Flex Ray) 신호를 이더넷(ethernet) 방식을 통해 컴퓨터에 연결할 수 있는 것
14	8479	82	혼합기, 분쇄기	실험용 소형 분쇄혼합기(분산기를 포함한다)로서 혼합기능과 분쇄 기능을 모두 갖추고 있는 것
15	8479	89	알칼리 이온수 생성장치	수소이온농도가 13.1피에이치(pH) 이상 13.2피에이치(pH) 이하인 알칼리 이온수 80리터(ℓ)를 연속 생성하여 내부펌프로 외부로부터 급수할 수 있는 것
16	8479	89	자동 열탈착기 (Automated Thermal Desorber, Pyrolyzer)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.
				1. 시료에서 휘발성 물질을 열탈착방식으로 흡착튜브에 흡착 또는 포집한 후 기체 크로마토그래피(gas chromatography)에 주입시켜 분석할 수 있는 것 2. 시료에서 휘발성 물질을 열탈착방식으로 질량에 따라 분리하여 정량분석 또는 정성분석할 수 있는 것.
17	8479	89	정적(定積) 시료채취기 (Constant Volume Sampler)	회석된 배기가스의 유량을 임계류벤추리(CFV: Critical Flow Venturi)로 일정하게 채취할 수 있는 것

18	8479 8543	89 30	도금기, 코팅머신(Coating Machine)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.
				1. 자동차 피스톤링(piston ring)에 다이아몬드-라이크카본(DLC, Diamond Like Carbon) 또는 4면체비정질탄소(TAC, Tetrahedral Amorphous Carbon)를 코팅할 수 있는 것
				2. 로드(rod)증발원을 탑재하여 아크 스팟(arc spot)의 위치와 막 두께의 분포를 자동으로 제어할 수 있는 것
19	8504 8504 8504	32 34 40	전원공급기 (Power Supply)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.
				1. 전압이 35볼트(V) 이상이거나 전류가 2암페어(A) 이상인 것
				2. 정격 출력이 2메가볼트암페어(MVA) 이상이거나 1킬로와트(kW) 이상인 것
20	8514	19	노(爐, Furnace), 오븐, 열처리장치, 열압축가공기, 연속식 소성로 모의 실험장치	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.
				1. 전기로(電氣爐)로서 최고 온도가 500도(°C) 이상이고 온도의 허용 오차 범위가 ±8도(°C) 이하인 것
				2. 가열 시 내부 온도를 측정할 수 있는 것
21	8535	21	차단기 (Back-up Breaker)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.
				1. 전기로(電氣爐)로서 최고 온도가 500도(°C) 이상이고 온도의 허용 오차 범위가 ±8도(°C) 이하인 것
				2. 가열 시 내부 온도를 측정할 수 있는 것
22	8543	70	무선주파수 수신기 (EMI Test Receiver)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.
				1. 전기로(電氣爐)로서 최고 온도가 500도(°C) 이상이고 온도의 허용 오차 범위가 ±8도(°C) 이하인 것
				2. 가열 시 내부 온도를 측정할 수 있는 것
23	8543	70	무선 주파수 신호증폭기, 고주파 증폭기, 주파수변환기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.
				1. 전기로(電氣爐)로서 최고 온도가 500도(°C) 이상이고 온도의 허용 오차 범위가 ±8도(°C) 이하인 것
				2. 가열 시 내부 온도를 측정할 수 있는 것
24	8543	70	배터리 충전·방전 설비(Battery Testing System)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.
				1. 전압이 35볼트(V) 이상이거나 전류가 2암페어(A) 이상인 것
				2. 정격 출력이 2메가볼트암페어(MVA) 이상이거나 1킬로와트(kW) 이상인 것

25	9011	20	광학현미경 (Optical Microscope), 형광현미경 (Fluorescent Microscope), 주사전자현미경 (Scanning Electron Microscope)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.
				1. 광학현미경(optical microscope) 또는 형광현미경(fluorescent microscope)으로서 영상을 촬영할 수 있고 컴퓨터(PC)와 연결할 수 있는 것
				2. 시료의 표면 상태를 감지하고 분석할 수 있으며 영상 처리할 수 있는 주사전자현미경(SEM, Scanning Electron Microscope)
26	9013	80	조사(照射)기	빛이 떨어지는 각도(telecentricity, 직광성)가 90도에서 1도 이하로 차이나는 것
27	9029	10	계수기 (Counter)	자동차 피스톤링(piston ring)의 계수기로서 방향 선별 기능을 가지고 있는 것
28	9030	33	저항계	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.
				1. 반도체, 평판디스플레이 또는 이차전지 연구용으로서, 웨이퍼박막, 글래스기판박막, 필름 또는 분체(粉體)의 저항을 측정할 수 있는 것
				2. 시료에 전자빔을 쬐여(照射) 전류를 증폭시키는 비접촉방식으로 저항을 분석할 수 있는 것
29	3902	90	레진 안톤 (Resine Arton)	최대 인장강도는 71메가파스칼(MPa), 인장탄성율은 2,450메가파스칼(MPa)이고 성형수축률이 0.6%인 것
30	3920	10	이축연신 폴리에틸렌 필름(BOPE Film)	인장강도가 길이방향(MD, Machine Direction)은 70메가파스칼(Mpa) 이상이고 폭방향(TD, Transverse Direction)은 150메가파스칼(MPa) 이상이며, 코로나 처리(corona treatment)가 된 것의 표면장력이 38다인(dyne) 이상이며, 롤(roll)상태인 것으로서 펼친 길이가 6,000미터(m)인 것
31	8419	33	동결 건조기 (Freeze Dryer)	4개의 선반에서 최대 6킬로그램(kg)의 용량을 실험할 수 있고, 진공 압력은 15파스칼(Pa) 이하이고, 영하 35도(°C) 이하로 동결건조할 수 있으며, LED 디스플레이로 진행 시간과 온도를 확인할 수 있는 것
32	8438	20	초콜릿 템퍼링 기기 (Chocolate Tempering Machine - Batch Type)	온도를 60도(°C) 이상 가열할 수 있으며, 초콜릿을 한번에 8킬로그램(kg) 까지 녹일 수 있고 공랭(空冷) 방식으로 열을 식히며, 회전판의 속도 조절을 통해 초콜릿을 템퍼링(tempering) 할 수 있는 것
33	8438	20	땅콩 설탕 코팅기 (Peanut Sugar Coating Machine)	통의 직경은 600mm 이며 회전 속도는 분당 36회(r/min)이고, 생산 능력은 시간 당 3kg 이며, 공기 송풍기로 초콜릿 코팅 농도 및 두께 조절이 가능한 것
34	8444	00	방사기	압출기, 냉각장치, 연신롤러로 구성되어있는 특수 소형 섬유방사기로서, 압출기 스크루(screw)의 지름이 30파이(Ø)이상 40파이(Ø) 이하이고, 스피닝 헤드(spining head)가 400도(°C)까지 견딜 수 있으며, 연신롤러 및 와인더(winder)의 처리속도가 분당 2,500미터(m) 이상인 것

35	8456	90	듀얼 집속 이온빔 (Dual Focused Ion Beam) 동작기	해상도가 2.5나노미터(nm) 이상 30킬로전자볼트(keV) 이하이며, 전자빔의 에너지가 500전자볼트(eV) 이상 30킬로전자볼트(keV) 이하, 탐침(probe) 전류가 1피코암페어(pA) 이상 100나노암페어(nA) 이하인 것
36	8477	20	압출기 (Measuring Extruder)	필름 제조 시 스크루(screw)의 회전속도가 0.2알피엠(rpm) 이상 150알피엠(rpm) 이하이며, 속도를 0.1알피엠(rpm) 단위로 조절할 수 있는 것
37	8477	59	성형기 (Vacuum Compression Molding Machine)	프레스(press) 방식의 것으로서, 비구면 실리콘 렌즈 또는 비구면 유리 성형이 가능하거나 최대 성형 압력이 30톤 이상인 것
38	8477	80	제작기 (Modular Film Analyzer)	필름을 감을 때 속도와 장력(tension)을 조절할 수 있는 것
39	8479	82	분쇄기 (Air Classifying Mill, Wet Mill)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 분쇄 속도 범위(mill speed range)가 500알피엠(rpm) 이상 20,000알피엠(rpm) 이하이고, 바람의 양이 시간 당 10세제곱미터(m³) 이상 200세제곱미터(m³) 이하이며, 드라이브(drive) 전원이 0.5킬로와트(kW) 이상 5.0킬로와트(kW) 이하이고, 작업 단위가 시간 당 2킬로그램(kg) 이상 50킬로그램(kg) 이하인 것 2. 연삭(grinding) 실량이 8.5리터(L)이고, 배치(batch) 크기가 10리터(L) 이상 500리터(L) 이하이며, 드라이브(drive) 전원이 10킬로와트(kW) 이상 50킬로와트(kW) 이하이고, 순환방식 처리량이 시간 당 500킬로그램(kg) 이상 5,000킬로그램(kg) 이하인 것
40	8479	89	점토 가공기 (Portable Mill System)	산업용 점토를 가공하여 3차원 데이터를 형상화할 수 있는 것
41	8479 8537	89 10	가스분석기 통제 장치(Exhaust Gas Analyzer Control System)	컴퓨터 제어 방식의 것으로서 가스 분석기를 제어하면서 데이터를 수집하고 연산할 수 있는 것
42	8543	70	글로우 방전 광학 방출 분광기 (Pulsed RF Glow Discharge Optical Emission Spectrometry)	모든 원소(all elements)를 동시에 검출할 수 있고, 펄스-알에프(pulsed RF)를 이용하여 텡스 프로파일링(depth profiling)을 할 수 있는 것
43	8543	70	분광타원해석기 (Spectroscopic Ellipsometer)	기판에 빛을 쏘여서 박막의 두께와 반사도(reflective index)를 분석할 수 있는 것
44	8543	70	조도 및 형상 측정기 (Alpha Step)	코팅기판의 표면의 형상을 평가할 수 있거나, 코팅층의 두께를 0.1나노미터(nm)부터 1밀리미터(mm)까지의 범위에서 평가할 수 있는 것으로서 코팅기판을 물리적으로 분석할 수 있는 것

45	8543	70	스위치 매트릭스 (Switch Matrix)	계측기와 다수의 측정 대상 반도체 소자를 동시에 연결할 수 있으며 스위치를 통해 측정 대상을 바꿀 수 있는 것
46	8543	70	감쇠(減衰)기 (Programmable Attenuator)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 근거리 무선통신(Bluetooth/WiFi 등) 안테나 신호의 세기를 조절할 수 있는 것 2. 계측기와 측정 대상 사이에 연결되어서 측정값의 잡음(noise)을 제거할 수 있는 것